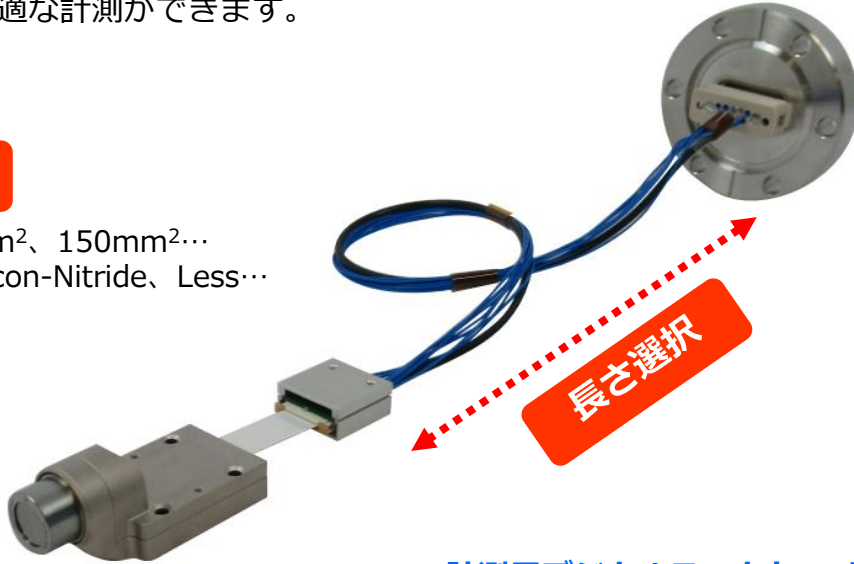


XSD50-01-DT-ICF-SYS

真空槽内に自由な配置をすることができる省スペースSDDシステムです。
SDDの仕様を選び最適な計測ができます。

SDD選択

面積：30mm²、50mm²、150mm²…
窓材：Graphen、Silicon-Nitride、Less…



計測用デジタルスペクトロメータ APU101X



計測モード：ヒストグラム、リスト、
Quick-Scan、ROI-SCA

ADCサンプリング：100Msps 16-bit

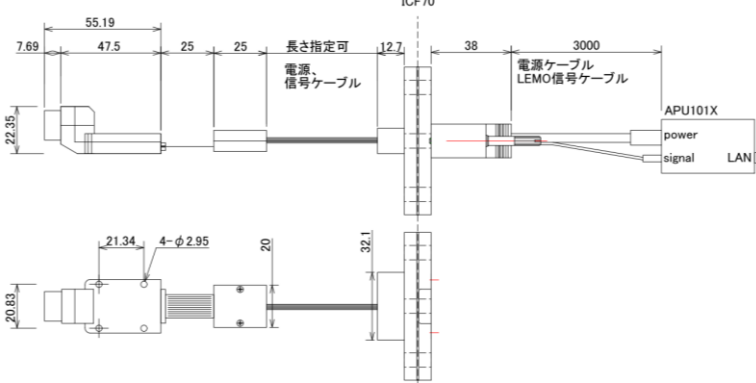
通信I/F：イーサネット (TCP/IP)

寸法 (mm)：210 (W) x 45 (H) x 275 (D)

付属

- ・Windows版データ収集アプリ
- ・外部PC制御用コマンドマニュアル
- ・各種サンプルプログラム

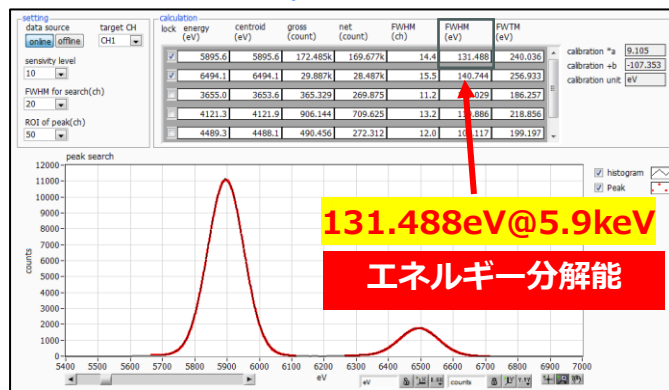
真空側 大気側



仕様

素子面積	75mm ² ※装着するSDDに依る
有効面積	50mm ² ※装着するSDDに依る
ウインドウ	Beryllium、Graphen、Silicon-Nitride、window-less
冷却	ペルチェ素子
ケーブル長	可変
材質	筐体：アルミニウム
消費電力	高压電源：-168V@200μA プリンアンプ電源：±5V@30mA ペルチェ電源：+1.4V@0.4A

データ収集アプリケーション Peak Search Analysis 実行画面



*写真はイメージです。
*記載内容は予告なく変更することがあります。

